

## ANEXO IV - Critérios de Classificação das Propostas



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE  
MINAS GERAIS  
CAMPUS INCONFIDENTES**

Conforme tabela de critérios deliberada em reunião da Câmara de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (CAPEPI), no dia 11/12/2019.

<b>Critério para Análise</b>	<b>Pontuação</b>
<b>PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA</b>	
Artigos completos publicados em periódicos	2
Livros publicados/organizados ou edições	2
Capítulos de livros publicados	1
Textos publicados em jornais e notícias/revistas	0,2
Trabalhos completos publicados em congressos	0,8
Resumos expandidos publicados em congressos	0,5
Resumos publicados em anais de congressos	0,2
Apresentação de trabalho	0,2
Demais tipos de produção bibliográfica	0,1
<b>PRODUÇÃO TÉCNICA</b>	
Produtos tecnológicos	0,5
Processos ou técnicas	1
Trabalhos técnicos	0,5
Outras produções técnicas	0,1
<b>ORIENTAÇÕES</b>	
Supervisões de pós-doutorado	2
Orientações de tese de doutorado	4
Orientações de dissertações de mestrado	3
Orientações de monografias de cursos de aperfeiçoamento/especialização	1
Orientações de trabalho de conclusão de curso	0,5
Orientação de iniciação científica	1
Orientações de outras naturezas	0,1
<b>EVENTOS</b>	
Participação em eventos, congressos, exposições e feiras	0,1
Organização de eventos, congressos, exposições e feiras	0,5
<b>BANCAS</b>	

Participação em banca de trabalhos de conclusão - teses de doutorado	1
Participação em banca de trabalhos de conclusão - qualificações de doutorado e mestrado	0,8
Participação em banca de trabalhos de conclusão - mestrado	0,6
Participação em banca de trabalhos de conclusão - monografias de cursos/aperfeiçoamento de cursos de especialização	0,4
Participação em banca de trabalhos de conclusão - trabalho de cursos de graduação	0,2
<b>INOVAÇÃO</b>	
Patente (carta patente)	5
Patente (depósito)	1,5
Programa de Computador registrado	3
Cultivar protegida	3
Cultivar registrada	5
Desenho industrial registrado	3
Marca registrada	3
Topografia de circuito integrado	2